

(11)Publication number:

03-222376

(43) Date of publication of application: 01.10.1991

(51)Int.CI.

H01L 33/00 H01L 21/205

(21)Application number: 02-017591

(71)Applicant : KOBE STEEL LTD

(22)Date of filing:

26.01.1990

(72)Inventor: KOBASHI KOJI

MIYATA KOICHI KUMAGAI KAZUO MIYAUCHI SHIGEAKI

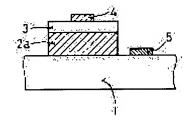
MATSUI YUICHI

(54) DIAMOND SEMICONDUCTOR LIGHT EMITTING ELEMENT

(57)Abstract:

PURPOSE: To enable a diamond semiconductor light emitting element to emit light rays of different colors in a short wavelength range by a method wherein a diamond semiconductor layer, a diamond insulator layer, and a front electrode are successively provided onto a conductive substrate, and a back electrode is provided coming into ohmic contact with the conductive substrate.

CONSTITUTION: A P-type diamond semiconductor layer 2a is synthesized in vapor phase on a low resistive Si substrate (silicon wafer) 1. In succession, a diamond insulator layer 3 is formed thereon, furthermore a front electrode 4 is built thereon, and a back electrode 5 is formed coming into ohmic contact with the Si substrate 1. If a voltage of 350V or so is applied between the electrodes 4 and 5 of this. diamond semiconductor light emitting element so as to make the front electrode 4 negative in potential, the light emitting element starts emitting green white light rays, and the element can be easily enhanced and controlled in emission intensity without causing dielectric breakdown by



increasing the applied voltage. The relation between the applied voltage and emission intensity can be varied by changing the diamond insulator layer 3 in thickness.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or

application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3−222376

®Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)10月1日

H 01 L 33/00 21/205 A 8934-5F 7739-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

ᡚ発明の名称 ダイヤモンド半導体発光素子

②特 願 平2-17591

22出 願 平2(1990)1月26日

⑫発 明 者 小 橋 宏 司 兵庫県西宮市高須町2-1,31-440

⑩発 明 者 宮 田 浩 一 兵庫県明石市荷山町2725-2

⑩発 明 者 熊 谷 和 夫 兵庫県神戸市灘区篠原伯母野山町2-3-1

⑩発 明 者 宮 内 重 明 兵庫県神戸市灘区篠原伯母野山町2-3-1

⑩発 明 者 松 居 祐 一 兵庫県神戸市灘区篠原伯母野山町2-3-1

⑪出 願 人 株式会社神戸製鋼所 兵庫県神戸市中央区脇浜町1丁目3番18号

邳代 理 人 弁理士 金丸 章一

明細書

1. 発明の名称

ダイヤモンド半導体発光素子

- 2.特許請求の範囲
- (I) 導電性基板上に順次ダイヤモンド半導体層 とダイヤモンド絶縁体層とを備え、前記ダイヤモ ンド絶縁体層上に表電極を設け、更に前記導電性 基板に対しオーム性接触を有する裏電極を設けた ことを特徴とするダイヤモンド半導体発光素子。
- 3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

この発明は、ダイヤモンド半導体を用いて短波 長の青白色などを発光させる新規な素子構造を有 する、ダイヤモンド半導体発光素子に関するもの である。

〔従来の技術〕

周知のように、ダイヤモンドは、5.5 e Vの 広いバンドギャップをもっており、短波長領域の 固体発光材料として期待されている。

気相合成法などの合成技術によりB(ホウ素)

をドープした p 型ダイヤモンド半導体が得られるが、これを利用して、短波長の光を発光させるダイヤモンド半導体発光素子の研究開発が進められており、第5 図に示すような構造の素子が提案されている(応用物理学会、1989年春期学会講演予稿集、第2分冊、p.481)。

同図において、51はダイヤモンド単結晶基板、52はこのダイヤモンド単結晶基板51上に気相合成によりBをドープして形成されたp型ダイヤモンド半導体層、53はp型ダイヤモンド半導体層52に対しショットキー型接触を示すW(タングステン)からなるショットキー電極、54はp型ダイヤモンド半導体層52に対しオーミック接触を示すTi(チタン)からなるオーミック電極である。

上記構成になるダイヤモンド半導体発光素子の 発光機構を第6図に基づいて説明する。第6図は 上記第5図に示すダイヤモンド半導体発光素子に おいてショットキー電極53に正の電圧を印加した 場合のエネルギーバンド図であって、同図におい て、Vは印加電圧、E,はフェルミ準位、E。は P型ダイヤモンド半導体層52の伝導帯下端のエネルギー、 E、 はその価電子帯上端のエネルギー、 白丸は正孔、黒丸は電子を示す。 両電極間にショットキー電極53が正となるような電圧 V を印加すると、正孔がトンネル効果によりショットキー電極53から P型ダイヤモンド半導体層52へ移動し、この移動した正孔が欠陥準位で電子と再結合して 骨白色の発光を生じる。

(発明が解決しようとする課題)

しかしながら、上記構成になる従来のダイイ半半年 なるがら、上記構成になる従来のダイイ半半年 なるがイヤモンタイイを発光素子では、p型接触を示すショットキー型接触を示す事体のの では短い、いわゆる金属電極・半導体のも、半導体のも、とのショットキー特性はp型が半端である。 など半導体をでするため、中ではないで、 では、などでは、などではないで、 では、などでは、などでは、などではないで、 などでは、などでは、などではないで、 などのでは、このでは、 などでは、などでは、 などでは、などでは、 などのでは、 などのでは、 などのでは、 などのでは、 などのでは、 などのでは、 などのでは、 などのでいる。 などがなどのでいる。 などのでいる。 などのでいる。 などのでいる。 などのでいる。 などのでいる。 などが、 など

る。

(作用)

上記のように構成されるこの発明によるダイヤ モンド半導体発光素子の発光機構を以下に説明す る。第3回はダイヤモンド半導体層がp型の場合 の発光機構の説明図である。この場合、この発明 によるダイヤモンド半導体発光素子は、その模式 構造図の第3図(a)に示すように、導電性基板11上 に、順次、p型ダイヤモンド半導体層12aとダイ ヤモンド絶縁体層13とを積層し、ダイヤモンド絶 経体暦13上に例えば金属からなる表電極14を設け 、さらに、導電性基板11に対しオーミック接触を 示す例えば金属からなる裏電極15を設けてなる構 造としている。第3図(0)は順方向バイアス状態に おけるエネルギーバンド図である。 第3図60では 、ダイヤモンド絶縁体暦13、 p 型ダイヤモンド半 導体層12a それぞれにおいて、伝導帯下端のエネ ルギーをEci、Ecz、価電子帯上端のエネルギー をEu、Euとして示す。また、フェルミ準位を E,、正孔を白丸、電子を黒丸として示す。

体層への不純物のドーピング量に強く依存するので、所定のショットキー特性を確保した上でドーピング量を変化させることがむずかしく、このため、短波長域において異なる発光色が容易にキー電極側に正の電圧を印加する逆方向バイマ電圧を印加するで、発光する電圧であるため、発光する電圧であるため、発光する電圧でおけ、発光強度を変えるための電圧制御が容易でないという欠点もある。

この発明は、上記従来の欠点を解決した新規な 素子構造を有するダイヤモンド半導体発光素子の 提供を目的とする。

(課題を解決するための手段)

上記従来の欠点を解決するため、この発明によるグイヤモンド半導体発光素子は、導電性基板上に順次ダイヤモンド半導体層とダイヤモンド絶縁体層とを備え、前記ダイヤモンド絶縁体層上に表電極を設け、更に前記導電性基板に対しオーム性接触を有する裏電極を設けたことを特徴としてい

次に、ダイヤモンド半導体層がn型の場合の発 光機構をその説明図の第4図に基づいて以下に説明する。この場合、この発明によるダイヤモンド 半導体発光素子は、その模式構造図の第4図(a)に 示すように、ダイヤモンド半導体層としてはn型 ダイヤモンド半導体層12 b を有し、他の構成としては上記の第3 図(a)に示すものと同様の構成である。第4 図(b)は順方向バイアス状態におけるエネルギーバンド図であって、同図では、上記第3 図(b)と同様に、ダイヤモンド絶縁体層13、 n 型ダイヤモンド半導体層12 b それぞれにおいて、伝導帯下端のエネルギーをEci、Ecz、価電子帯上端のエネルギーをEvi、Evzとして示す。また、フェルミ準位をEvi、正孔を白丸、電子を黒丸として示す。

第4図(b)において、両電極間14、15に表電極14 が正となるような電圧 V を印加すると、つまり順方向パイアス状態にすると、ダイヤモンド絶縁体層13のエネルギーパンドは n 型ダイヤモンド半導体層12 b との界面方向へその E c i、 E v i が上昇するように曲がり、その結果、 n 型ダイヤモンド半導体層12 b 表面のエネルギーパンドは図に示すように上向きに曲がり、界面付近の価電子帯側にエネルギーパンドのくびれが形成される。このことにより、正孔がトンネル効果により表電極14から

に、ダイヤモンド絶縁体層 3 上には、微細加工技術を用いて、Ti、次いでAuを蒸着して積層してなる表電極 4 を形成するとともに、図に示すように、Si基板 1 のp型ダイヤモンド半導体層 2 a 側の面上には、このSi基板 1 に対しオーミック接触を示すAuを蒸着してなる裏電極 5 を形成した。

このようにして作製したダイヤモンド半導体発 光素子の両電極間4、5に表電極4個が負となる ように350V程度の電圧を印加すると、緑白色 の発光が得られた。また、印加電圧を上げること により絶縁破壊を生じることなく発光強度を容易 に高め調整することができた。なお、ダイヤモン ド絶縁体層3の厚みを変えることによっても印加 電圧と発光強度との関係を変化させることができる。

第2図はこの発明のさらに他の実施例によるダイヤモンド半導体発光素子の構造を模式的に示す 断面図である。なお、第1図のものと同様の構成 をなすものは同一符号で説明する。第2図に示す このくびれへ移動して蓄積され、この正孔が n型 ダイヤモンド半導体層12b中の格子欠陥による欠 陥準位などで電子と再結合して発光を生じる。

(実施例)

以下、実施例に基づいてこの発明を説明する。 第1図はこの発明の一実施例によるダイヤモンド半導体発光素子の構造を模式的に示す断面図である。同図に示すように、低抵抗のSi基板(シリコンウェハ)1上に、選択成長技術を用いて、所定の大きさの厚み10μmのp型ダイヤモンド半導体層2aを気相合成した。p型ダイヤモンド半導体層2aの気相合成は、マイクロ波ブラズマCVD法でメタン0.3vol %、ジボラン(BzH。)0.00005vol %、残り水素(vol %)とする反応ガスを使用して行った。

次いで、このBをドープしたp型ダイヤモンド 半導体層 2 a 上に、メタン 0.3 vol %、水素 9 9.7 vol %とする反応ガスを用いて厚み 0.5 μ m のノンドープのダイヤモンド絶縁体層 3 をマ イクロ波プラスマ C V D 法により形成した。さら

ように、低抵抗のSi基板1上に、選択成長技術 を用いて、厚み 1 0 μmの n 型ダイヤモンド半週 体層 2 b を気相合成した。 n 型ダイヤモンド半導 体層 2 b の気相合成は、マイクロ波プラズマCV D法でメタン0. 3 vol %、シラン(SiH4) O. O 0 5 vol %、残り水素 (vol %) とする反応ガス を使用して行った。次いで、このSiがドープさ れたn型ダイヤモンド半導体層2b上に、マイク ロ波プラズマCVD法によりメタンO. 3 vol % 、水素99.7vol %とする反応ガスを使用して 厚みが0. 5μmのノンドープのダイヤモンド絶 緑体層 3 を形成した。さらに、ダイヤモンド絶縁 体層 3 上には、微細加工技術を用いて、Ti、次 いでAuを蒸着して積層してなる表電極4を形成 し、また、Si基板1のn型ダイヤモンド半導体 層 2 b の反対側の面上には、S i 基板 l に対しオ ーミック接触を示すAuを蒸着してなる富電極5 を形成した。

このようにして作製したダイヤモンド半導体発 光素子の両電極間 4 、 5 に表電極 4 倒が正となる ように 4 0 0 V 程度の電圧を印加すると、春白色の発光が得られた。また、印加電圧を上げることにより絶縁破壊を生じることなく発光強度を容易に高め調整することができた。

(発明の効果)

以上説明したように、この発明によるダイヤモンド半導体発光素子は、表電極とp型あるいはn型ダイヤモンド半導体層との間にダイヤモンド絶縁体層を挟み発光を得る素子構造としたので、ダ

型の場合の発光機構の説明図、第5図は従来のダイヤモンド半導体発光素子の構成を説明するための図、第6図は第5図に示す従来のダイヤモンド半導体発光素子の発光機構を説明するためのエネルギーバンド図である。

1、11…低抵抗のSi基板(導電性基板)、 2 a、12 a……p型ダイヤモンド半導体層、 2 b、12 b……n型ダイヤモンド半導体層、

3、13……ダイヤモンド絶縁体層、

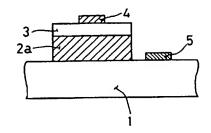
4、14…表電極、5、15…裏電極。

イヤモンド半導体層への不純物のドーピング量を 、従来のように金属で極・ダイヤモンド半導体層 の接触特性(ショットキー特性)に制約される。 において登立でき、これにより、短波を見いたのでき、これに得られる。 を光を得るにあたり、ダイヤモンド半導体により におかてするにあたり、ダイヤモンド半導体に対 して、発光強度の調整はこの順方向に印加する を超こす心配がなく、短波といてき、絶縁子として 変用的に極めて有用である。

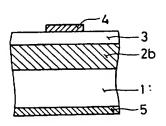
4.図面の簡単な説明

第1図はこの発明の一実施例によるダイヤモンド半導体発光素子の構造を模式的に示す断面図、第2図はこの発明の他の実施例によるダイヤモンド半導体発光素子の構造を模式的に示す断面図、第3図はこの発明によるダイヤモンド半導体発光素子のダイヤモンド半導体層がn型の場合の発光徴構の説明図、第4図はこの発明によるダイヤモンド半導体層がn

第1図

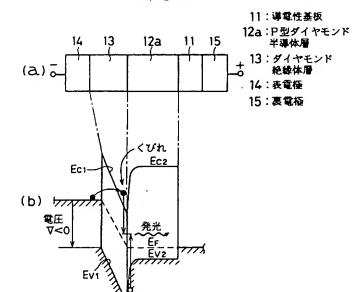


第2図



特許出願人 株式会社神戸製鋼所 代理人 弁理士 金丸 章一

第3図



第4図

